



CENTRE FOR
NANOSTRUCTURED
INTERFACES
AND SURFACES



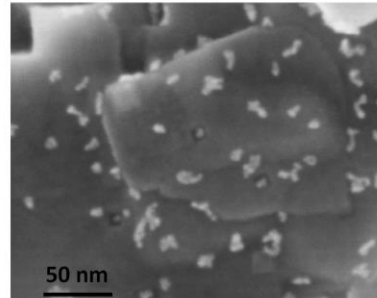
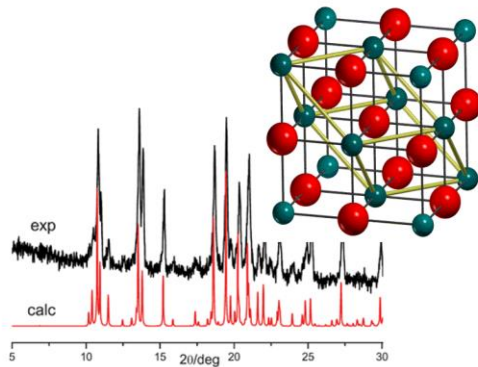
NIS colloquium

INFRA-P: Presentazione finale del progetto SAX “Strumentazioni Avanzate per Sistemi Complessi”

Mercoledì 9 Ottobre 2019

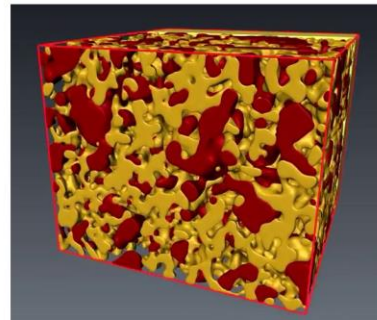
Università di Torino, Centro dell’Innovazione, Via Quarello 15/A, Aula 17

Diffractometry



High Resolution
Electron Microscopy

Industrial Tomography



Space-resolved
chemical analysis

Nel corso della giornata verranno presentati i risultati del progetto SAX, finanziato dal Bando Infra-P della Regione Piemonte per il potenziamento delle infrastrutture di ricerca. Il progetto ha attrezzato una serie di laboratori per la caratterizzazione dei materiali con tecniche di microscopia, diffrattometria e tomografia. L’ambito tecnologico del progetto SAX è quello della produzione e trasformazione dei materiali nell’industria, con particolare riferimento allo sviluppo di materiali/prodotti innovativi ed al controllo della qualità. La strumentazione acquisita permetterà lo studio di materiali complessi ad innovativi grazie al controllo della loro struttura dal livello macroscopico (**tomografia**) alla microstruttura (**microscopia SEM**), fino a livello atomico (**diffrattometria**). Esempi di materiali di questo tipo sono i materiali metallici sia per produzioni tradizionali che per *additive manufacturing*, i ceramici per applicazioni tecnologiche, i *coating* superficiali, i materiali per sistemi catalitici *green* e sostenibili, i compositi a base di carbonio per applicazioni aerospaziali e *automotive*, i cristalli e co-cristalli molecolari di interesse farmaceutico ed agro-alimentare. Il progetto SAX consentito al NIS ed al DISAT di ampliare e potenziare i loro servizi di ricerca e di misura grazie all’acquisizione di strumentazioni avanzate uniche in ambito regionale e nazionale.



PROGRAMMA

14.30-15:00

Saluti istituzionali, presentazione del bando e del progetto

(Regione Piemonte, Dipartimenti di UniTO e PoliTO, Centro Interdipartimentale NIS)

15.00-15.30

Presentazione dei diffrattometri Rigaku SmartLab e Miniflex: caratteristiche ed applicazioni

(Dipartimento di Scienze della Terra - UniTO, Assing SpA)

15:30-15.45

Il potenziamento del diffrattometro per cristallo singolo e polveri Gemini Ultra: caratteristiche ed applicazioni.

(Dipartimento di Chimica - UniTO)

15:45-16:00

Pausa

16.00-16.30

Presentazione del nuovo microscopio elettronico FIB-FESEM/EBSD/TOF-SIMS Tescan S9000G: caratteristiche ed applicazioni

(Dipartimento di Chimica - UniTO, Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia – PoliTO, Assing SpA)

16.30-17.00

Presentazione del nuovo laboratorio multifunzione per irraggiamento e tomografia X: caratteristiche ed applicazioni.

(Dipartimento di Fisica, UniTO)

17.00-18.00

A cura dei Dipartimenti di Chimica e Fisica

Visite ai Laboratori SAX

Partecipazione gratuita con iscrizione al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTpYiK_mY3vKHylfvjBdcFX20r7FSyicISXdTo3-HvYzlhFQ/viewform?usp=sf_link



Chi fosse interessato a seguire il convegno da remoto può inviare una mail a info.nis@unito.it, per ricevere il link per il collegamento streaming tramite Webex (sufficiente normale browser).



Intervento finanziato dal Programma Operativo Regionale "Investimenti per la crescita e l'occupazione" F.E.S.R. 2014/2020. Obiettivo tematico I - Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione, Azione I.1.a.1.5